

MICROSCOPE À ÉLECTRONS LENTS (LEEM PEEM)

FICHE N° 938

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : ELMITEC

Domaines : Physique

Sous-domaines :

Organisme : Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM) , Faculté des Sciences
13288 Marseille

Ville : Marseille

Modèle :

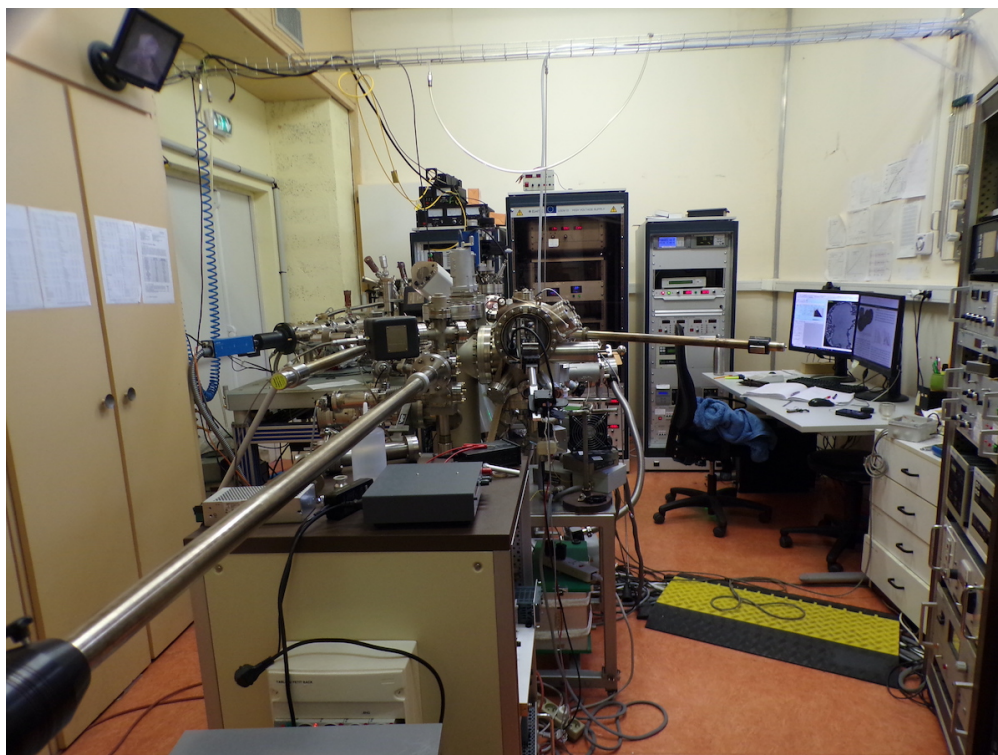
Matériaux :

Description

Le LEEM PEEM fabriqué par ELMITEC sert à observer des surfaces solides (silicium etc.). Le di- microscope, de chambres vide, et d'un microscope à effet tunnel. Principe scientifique de fonction- Les électrons sont accélérés vers l'échantillon. Ensuite les électrons sont ralentis, ils interagissent réfléchis, diffractés, et détectés par le détecteur. L'instrument apporte des informations sur la mo- cristalline des surfaces des matériaux, en particulier il permet d'observer des marches ato- d'acquisition d'images est de l'ordre de l'hertz, la résolution latérale de 10 nm. Il en existe 2 en Franc

Utilisation

Le dispositif est utilisé pour la recherche au Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (C



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique
PATSTEC, Microscope à électrons lents (LEEM PEEM) (ELMITEC),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=30806>, consulté le 2026-07-25